



标准编制工作组

SEMI HB8-0217

SEMI Standards Publication Certificate

SEMI 标准发布证书

NO.:2017-01

Standard No.: SEMI HB8-0217
标准编号: SEMI HB8-0217

Standard Name: Test Method for Determining Orientation
of a Sapphire Single Crystal

标准名称: 单晶定向检测方法

Publication Date: February, 2017

发布日期: 2017年2月

主编单位: 丹东新东方晶体仪器有限公司

参编单位: 福建晶安光电有限公司、哈尔滨奥瑞德光电技术
有限公司、南京京晶光电科技有限公司、贵州皓天
光电科技有限公司、中微半导体设备(上海)有限
公司、浙江东晶博蓝特光电有限公司

起草人: 赵松彬、甄伟、杭寅、谢斌晖、丁广博、安子键、
郑松森、齐六云、李天笑、刘建哲

